



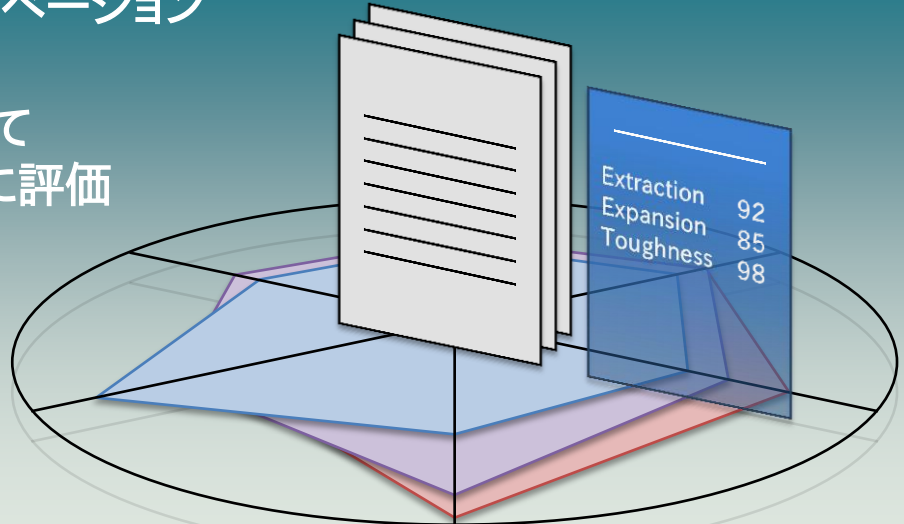
PatentValueAnalyst®

パテントバリューアナリスト

<特許多数出願中>

特許書類品質評価のイノベーション

パテントメトリクスを用いて
特許書類品質を定量的に評価



PatentValueAnalystは、特許書類の品質を定量的に評価します。

PatentValueAnalystは、品質評価の対象となる特許書類(特許出願書類、特許公報)から自然言語処理により抽出した約100種類のパテントメトリクス(※)を用いて、特許書類の品質を定量的に評価します。PatentValueAnalystは、算出式評価方式(PatentValueAnalyst-CF)と、学習評価方式(PatentValueAnalyst-SVM)の2つのエディションから構成されています。※パテントメトリクスとは、特許書類から抽出できる、品質に関わる数値パラメータのことです。

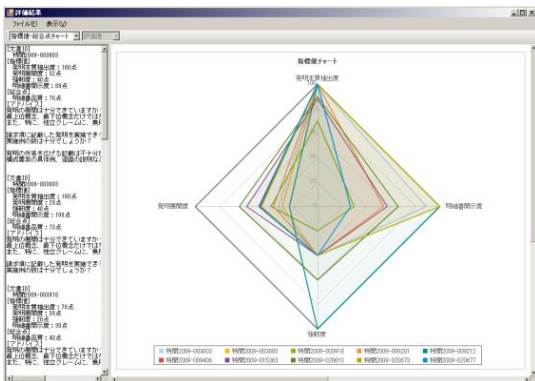
PatentValueAnalyst-CF

評価の仕組み

抽出したパテントメトリクスを、特許書類の品質特性ごとに設定された算出式に代入・計算することで、特許書類品質を評価します。

特徴

品質評価値に対する個々のパテントメトリクスの寄与度(係数)を詳細に設定することができます。つまり、特許書類品質の定義、特許書類品質の評価方法が決まっている場合に有効です。また、出力形式をカスタマイズすることで、出願前の特許出願書類の品質チェック等にも利用することができます。



PatentValueAnalyst-SVM

評価の仕組み

教師データとなる特許書類に対する評価点数と、それらの文書から抽出したパテントメトリクスとの関連性を分析・学習し、その結果に準じて特許書類品質を評価します。

特徴

人手による評価(教師データ)に近似した良好な結果を得ることができます。(相関係数:0.94)また、過去の品質評価結果を流用することができるので、導入コストを抑えることができます。また、SVMを採用していることで、より客観的で精度の高い評価が得られます。

SVM (Support Vector Machine)

SVMとは、教師あり学習のアルゴリズムの1つです。現在知られている多くの教師あり学習のアルゴリズムのうち、最も優れているといわれています。

評価項目

デフォルトでは、発明本質抽出度、発明展開度、強靭度、明細書開示度についての評価を行います。

カスタマイズ性

評価時に使用するパテントメトリクスはカスタマイズが可能です。デフォルトでは、請求項数や、請求項の階層構造の深さ等の約100種類のパテントメトリクスが用意されています。



有限会社アイ・アール・ディー

〒540-0008

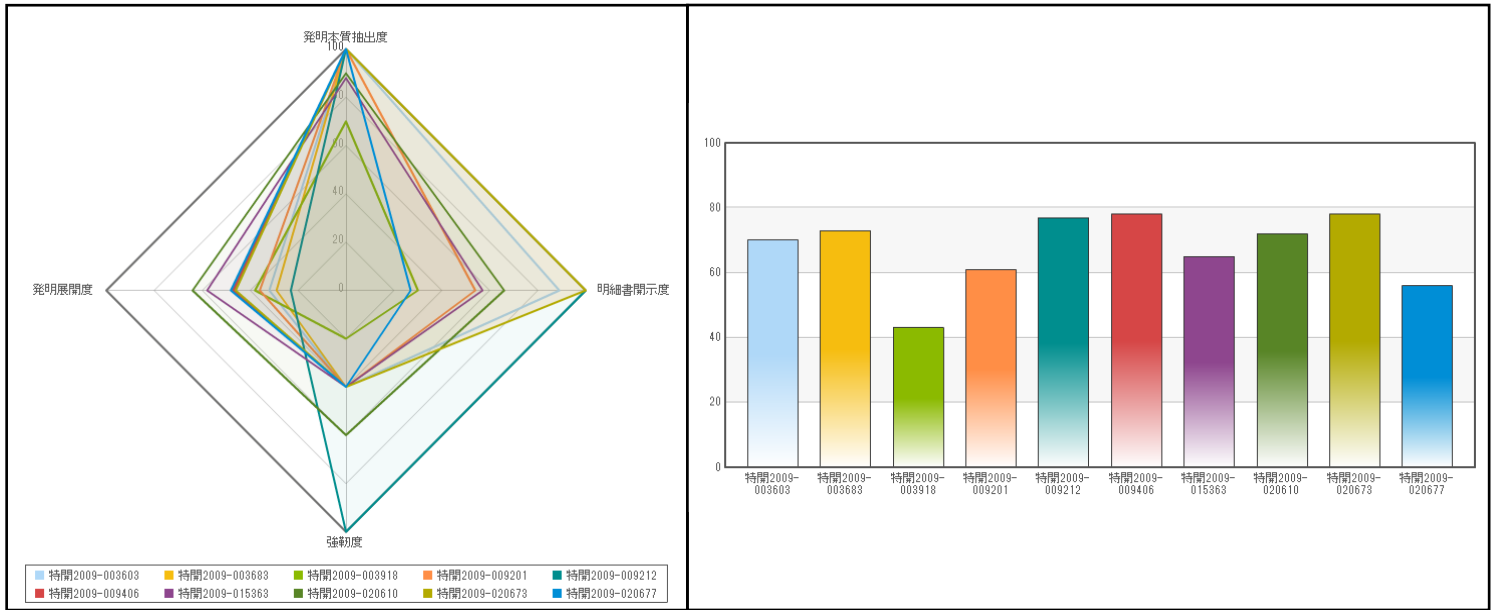
大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル8階 私書箱53号

TEL:06-6944-4530 FAX:06-6944-4531

http://corp.ird-pat.com/system_pva.html pva_support@ird-pat.com

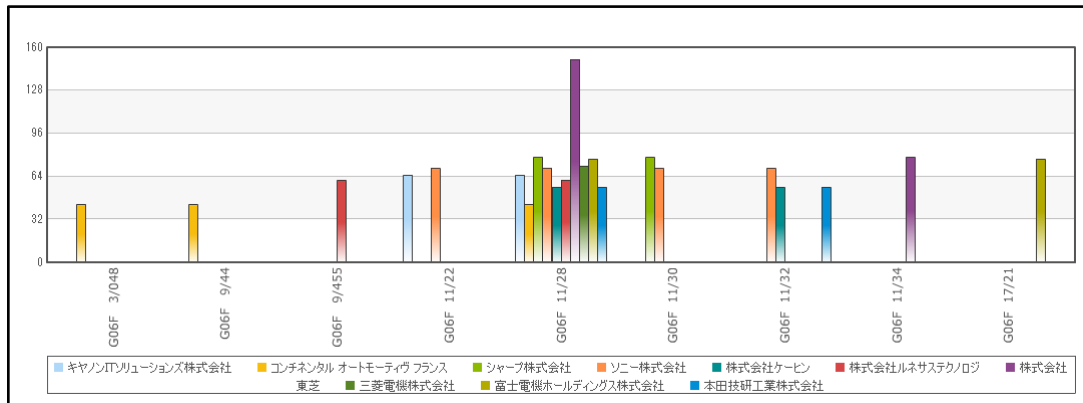
特性値表示機能

特許文書ごとに、評価結果(特性値・総合点)をレーダーチャート形式と棒グラフ形式で表示します。



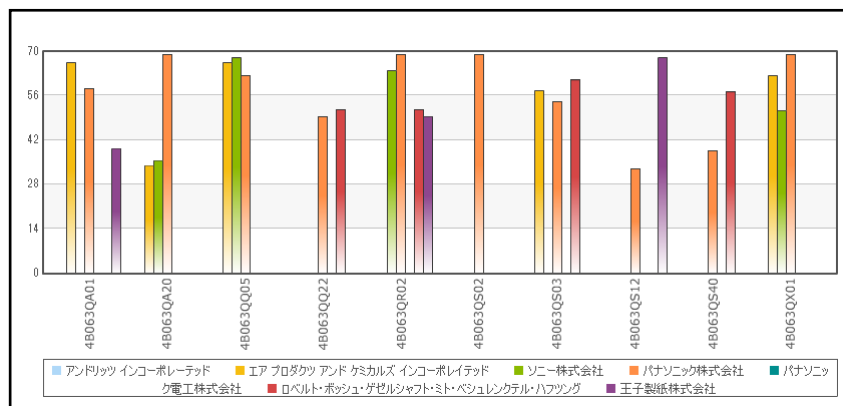
IPC別表示機能

IPC、会社・組織ごとに、評価結果(総合点)を棒グラフ形式で表示します。



Fターム別別表示機能

Fターム、企業・組織ごとに、評価結果(総合点)を棒グラフ形式で表示します。



PatentValueAnalystの動作環境

OS	<ul style="list-style-type: none"> ・Windows 8, 8.1 (32bit, 64bit) ・Windows 7 (32bit, 64bit) ・Windows Vista (32bit, 64bit)
マシンスペック	上記OSが動作するもの

本製品は、独立行政法人情報通信研究機構(NICT)の民間基盤技術研究促進制度に基づく委託研究「知的財産(特許・商標)構築・活用のための情報通信基盤技術の研究開発」(平成20年10月～平成22年9月)の研究成果に基づきます。